

# Chem 20™

Chemical Particle Counter

*Quickly detect and characterize chemical particle sources before they impact process and device performance with 20 nm particle counter sensitivity.*

*Without measurement there is no control*



液中パーティクルカウンタ Chem20™は、最先端の電子産業向け高品位薬液に含まれる不溶性微粒子を測定するために開発された、高感度の常時モニタリング装置です。Chem20™は、最小粒径検出感度20nmを達成した、業界初の液中パーティクルカウンタであり、Ultra DI® シリーズで実績のある光学系を耐薬品設計へ進化させることにより、低偽計数で且つ優れた測定安定性を実現いたしました。

## BENEFITS

- 20nmレベルの微小粒子数の変動を常時モニタリング可能
- 優れた測定安定性
- 低偽計数
- 短時間でのクリアダウン
- 9nm-Au/20nm-PSLを用いた製品評価が可能

## FEATURES

- 装置組み込みディスプレイにより、装置設定および測定データの表示が可能
- 4-20mAを用いた外部出力
- Facility Netを用いたクリーンルーム内総合環境モニタリングに対応
- ステンレススチール筐体とデュアルHEPAフィルターを搭載、クリーンルーム環境で使用可能
- 米国国立標準技術研究所（NIST）トレーサブルの校正基準採用

## APPLICATIONS

- 高品位薬液の常時モニタリング
- 高品位薬液のQAおよび受け入れ検査
- フィルター効率測定
- 超純水の常時モニタリング



**PARTICLE  
MEASURING  
SYSTEMS®**

a spectris company

# Chem 20™

Chemical Particle Counter

Specifications

粒径チャンネル範囲	20nm ~ 100nm	
チャンネル数	4	
チャンネルサイズ	20, 50, 70, 100 nm	
流量 (ml/min)	35 ml/min ± 10%	
偽計数	100個/L 以下	
最大可測粒子濃度 <sup>1</sup>	HIGH RESOLUTION MODE 2500 P/ml ≥ 20 nm 1000 P/ml ≥ 100 nm	HIGH CONCENTRATION MODE 500,000 P/ml > 20 nm 10,000 P/ml > 100 nm
サンプル温度範囲	15 - 40 °C	
最大試料圧力	75 psi, max	
接液面材質	PFA, PTFE, Sapphire, Kel-F®, Kalrez® 4079	
筐体材質	316L ステンレス製	
筐体寸法(l, w, h)	508 x 427 x 283 mm	
重量	27.2 kg	
電源	100 - 240 VAC	
レーザークラス	装置として : Class I (US21 CFR 1040.10 および EN60825-1) レーザー単体 : Class IV (EN60825-1)	
通信ポート	Ethernet (PMS protocol), 4-20 mA (5x 出力: 4x チャンネル出力, 1x 装置ステータス), RS-232 (データ出力無し、技術サポート用途のみ)	
ステータス表示	LCD および三色LEDによるステータス表示 (レーザー、通信、装置状態)	
校正	米国国立標準技術研究所 (NIST)と日本工業規格 (JIS)にトレーサブル	
使用環境	温度 : 18 ~ 28 °C ± 1 °C/時間 湿度 : 5 - 90%, 結露なきこと 設置場所 : 室内専用 室内汚染度 : 通常の家計及びオフィス環境相当である事 (Pollution degree 2) 振動 : 強度な機械や車両の振動が無い事 過電圧カテゴリ : コンセントに接続する電源コード付き機器 (Category II) 感電保護クラス : 基礎絶縁及び保護設置がなされている事 (Class I) 装置に水や湯気が長時間接する場所での使用不可 (防水防湿加工されていません)	

<sup>1</sup>計数損失が10%未満発生する粒子濃度

## PMS Japan

PMS日本支社  
(スペクトリス株式会社 PMS事業部)

〒210-0024  
神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビル4F

Tel: 044 589 3498

Fax: 044 245 5000

Email: pmsjapan@pmeasuring.com

サービスセンター (校正・修理)

Tel: 044 589 3418

Email: SVCpmsjapan@pmeasuring.com

[www.pmeasuring.com/jp/](http://www.pmeasuring.com/jp/)



Chem 20™ is a trademark of Particle Measuring Systems, Inc. Kel-F® is a registered trademark of 3M. Kalrez® is a registered trademark of Carl Freudenberg KG. All other trademarks are the property of their respective owners. Particle Measuring Systems, Inc. reserves the right to change specifications without notice. © 2019 Particle Measuring Systems, Inc. All rights reserved.